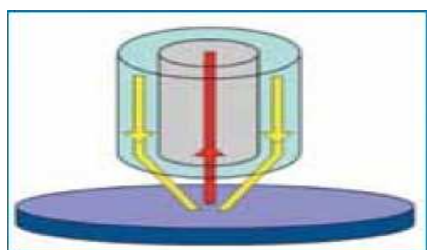


# SEMILAB社製 SE-2000用 反射率測定システム(反射率測定ヘッド)

長寿命キセノンランプと2層構造の石英光ファイバーを使用。非接触で高精度の反射率測定が可能です。



## 測定可能な物理特性

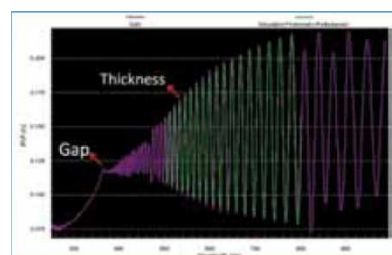
- 反射率
- フィルムの膜厚

## 仕様

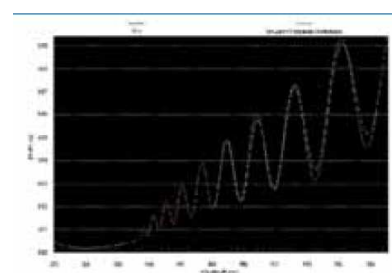
- スポットサイズ : 約500 $\mu$ m@633nm
- 波長範囲 : 380nm-950nm
- 測定スピード : 約100ms

## アプリケーション

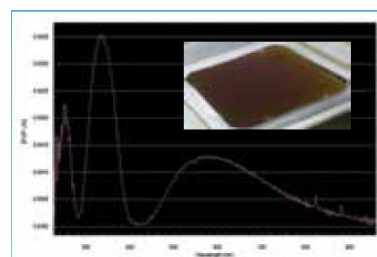
- 半導体
- シリコン、有機、化合物半導体
- 太陽電池
- ポリマー
- フラットパネル・ディスプレイ
- 医療、バイオ
- PETフィルム



LED



PV-Thin film : TCO



PV Silicon based

## SEMILAB社製 SE-2000用 反射率測定システム (Photometryオプション)

SEMILAB社製SE-2000用 PhotometryオプションをSE-2000にオプション追加することで、「エリプソメータの測定波長範囲」で反射率(斜入射)と透過率の測定が可能です。

- 反射率の測定では、エリプソ同様に入射角度を可変にできます。
- 透過率では、エリプソのアームを水平にしてサンプルをステージに垂直に立てて測定を行うこととなります。



本オプションに含まれるもの

- \* ソフトウェア
- \* 透過率測定用サンプルホルダー
- \* 反射率測定のためのリファレンスサンプル